

证券代码:003036 证券简称:泰祖股份 公告编号:2026-025 债券代码:1217096 债券简称:转债25

本次发行的可转债票面利率为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%...

重大风险提示: 1. 宏观经济环境变化风险; 2. 行业竞争加剧风险; 3. 核心技术人才流失风险; 4. 公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的质押或冻结等重大事项...

转债余额: 2026年4月27日收盘,“泰祖转债”价格为327.242元,转债余额为100元,转股价格为278.45元,转股数量为1.7525...

武汉精测电子集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文...

Table with 2 columns: Product Name (e.g., 80880 FT Test System) and Description (e.g., 最新量产型 FT80880 FT Test System 搭载全新 FT80880 处理器,搭载全新 DMA 架构...

4.股本及股东情况 (1)普通股股份变动及股东情况

Table with 2 columns: Shareholder Name (e.g., 湖北泰祖电子) and Shareholding Information (e.g., 持股数量: 22,886, 持股比例: 21.76%)

(一)主要业务概况 报告期内,公司主营业务聚焦于半导体、显示及新能源三大核心领域...

(3)先进封装检测领域 公司现有前道量检测设备(主要包括晶圆系列产品、OCB设备、电子束设备、明场光学缺陷检测设备)

Table with 2 columns: Product Name (e.g., D8000) and Description (e.g., 最新量产型 D8000 搭载全新 D8000 处理器,搭载全新 DMA 架构...

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 (1)债券基本情况

Table with 2 columns: Bond Name (e.g., 转债25) and Bond Details (e.g., 债券代码: 123176, 发行日期: 2023年03月01日)

(二)主要产品及用途 1.半导体检测领域 公司目前在半导体领域的主要产品为前道量检测设备、后道检测检测设备、先进封装检测设备...

(4)核心器件 1.WAT量测探针 用于探针量测及探针寿命管理。

Table with 2 columns: Product Name (e.g., WAT量测探针) and Description (e.g., 用于探针量测及探针寿命管理。)

2.平板显示检测领域 公司目前在显示领域的主要产品为LCD/OLED Mini-LED、Micro-LED、Micro-LED等各类显示器件的检测设备...

3.新能源检测领域 在新能源领域的主要产品为锂电池生产及检测设备,主要用于锂电池电芯装配与检测环节...

Table with 2 columns: Product Name (e.g., LCD/OLED Mini-LED) and Description (e.g., 用于LCD/OLED Mini-LED显示器件的检测。)

3.重要事项 报告期内,公司紧跟半导体设备国产化替代的关键窗口期,持续巩固并提升在半导体检测领域的国内领先地位...

Table with 2 columns: Item (e.g., 资产减值) and Value (e.g., 2025年: 58.92%, 2024年: 58.24%)

(三)主要财务数据及财务指标 (1)近三年主要财务数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产) and Value (e.g., 11,652,262,284.72)

(2)分季度主要财务指标 单位:元

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入) and Value (e.g., 689,402,011.49)

(3)主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产) and Value (e.g., 11,652,262,284.72)

(2)分季度主要财务指标 单位:元

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入) and Value (e.g., 689,402,011.49)

4.核心业务领域 在半导体检测领域,公司已实现从基础检测到完整制程的覆盖...

在新能源领域,公司紧跟新能源汽车动力电池行业快速发展,积极布局锂电池电芯装配与检测环节...

在显示领域,公司紧跟显示行业国产化替代的关键窗口期,持续巩固并提升在显示检测领域的国内领先地位...

在先进封装检测领域,公司紧跟先进封装技术快速发展,积极布局先进封装检测环节...

在核心器件领域,公司紧跟核心器件国产化替代的关键窗口期,持续巩固并提升在核心器件领域的国内领先地位...

在主要业务领域,公司紧跟主要业务领域国产化替代的关键窗口期,持续巩固并提升在主要业务领域的国内领先地位...

在重要事项领域,公司紧跟重要事项国产化替代的关键窗口期,持续巩固并提升在重要事项领域的国内领先地位...

在核心业务领域,公司紧跟核心业务领域国产化替代的关键窗口期,持续巩固并提升在核心业务领域的国内领先地位...

在主要业务领域,公司紧跟主要业务领域国产化替代的关键窗口期,持续巩固并提升在主要业务领域的国内领先地位...

在重要事项领域,公司紧跟重要事项国产化替代的关键窗口期,持续巩固并提升在重要事项领域的国内领先地位...

在核心业务领域,公司紧跟核心业务领域国产化替代的关键窗口期,持续巩固并提升在核心业务领域的国内领先地位...

在主要业务领域,公司紧跟主要业务领域国产化替代的关键窗口期,持续巩固并提升在主要业务领域的国内领先地位...

在重要事项领域,公司紧跟重要事项国产化替代的关键窗口期,持续巩固并提升在重要事项领域的国内领先地位...

公司半导体前道量测领域系列产品,OCB设备、电子束设备、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备...

①Efinn系列、IM系列、Scale系列、MetaPam系列晶圆量测设备 晶圆量测设备,集成晶圆量测、外延层厚度量测和金属膜厚度量测设备...

②Epsilon系列光学关键尺寸OCD量测设备 国内自主研发设计生产并率先应用的OCD量测的多功能型光学量测设备...

③View系列电子束缺陷检测设备 基于深度学习的智能全自动电子束缺陷检测与分类设备,具有高分辨率、高产能...

④Metric系列电子束关键尺寸量测设备 利用高分辨率扫描电子显微镜对光阻和刻蚀后图形进行在线式监控量测...

⑤BFI系列明场光学缺陷检测设备 面向先进制程,存储制版的图形晶圆缺陷检测设备,提供高精度、高分辨率、高检测率...

⑥TG系列硅片形貌量测设备 基于双面Fizeau干涉原理的全尺寸硅片形貌纳米级量测设备,在生产过程中对大硅片质量进行精确...

⑦FIB-SEM 集合了电子束高分辨率成像和FIB离子束纳米加工能力,用于晶圆制造过程中线路修补、失效分析...

⑧Vega系列先进封装缺陷检测设备 面向先进封装,集成先进封装缺陷检测设备,提供高精度、高分辨率、高检测率...

⑨AWT 先进的全面并行晶圆电测测试设备,对完成制程工艺后的晶圆进行晶圆电测测试,精确测试电流、电阻...

⑩Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

⑪Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

⑫Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

⑬Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

⑭Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

⑮Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

⑯Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

⑰Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

⑱Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

⑲Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

⑳Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

㉑Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

㉒Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

㉓Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

㉔Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

㉕Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

㉖Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

㉗Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

㉘Micro-LED ATE 测试系统 构建覆盖先进制程、SOC系统级芯片以及第三代功率半导体的全面测试系统...

精测电子半导体全领域量检测设备产品系列 包含前道检测领域、后道检测领域、核心器件等产品的详细列表和描述。